

Vrsta opreme: Visoko razlučivi transmisijski elektronski mikroskop

Proizvođač i model: JEOL JEM 2010

Godina proizvodnje: 1992.



Tehničke karakteristike:

- LaB6 žarna nit
- napona ubrzanja 200 kV
- povećanje do 1 000 000 x
- točkasta razlučivost 0.23 nm
- elektronska difrakcija konvergentnom zrakom

Namjena:

Promatranje ne-biloških uzoraka s konvencionalnom i visokom razlučivošću (atomska razlučivost). Elektronska difrakcija. Mogućnost određivanja kristalne strukture, veličine kristalnih zrna, defekata kristalne rešetke, itd.

Lokacija:

Sveučilište u Zagrebu

Prirodoslovno-matematički fakultet

Fizički odsjek, Zavod za eksperimentalnu fiziku

Laboratorij za mikrostrukturna istraživanja

Bijenička c. 32

Kontakt:

Doc. Željko Skoko

01/4605-555

zskoko@phy.hr